	(ì	(ļ	ć	a	ì	1	1	C	;	Ì	1	•	į	V	())	į	ť	(E	,	•	
																						ı				

Application/Control No

09/524,205 Examiner

Alain L. Bashore

Applicant(s)/Patent under Reexamination

SEGAL ET AL. Art Unit

1762

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
	:		<u>-</u> .
1		. :	
			,

INTERFERENCE SEARCHED								
Class	Subclass	Date	Examiner					
		-						
			,					

SEARCH NOTES (INCLUDING SEARCH STRATEGY)								
	DATE	EXMR						
EAST (attached)	5/31/2006	AB						
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
	1							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
.								